

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15021-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 25.11.2019

Ausstellungsdatum: 25.11.2019

Urkundeninhaber:

**Oelze Präzisions-Meßzeugfabrik Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Bollenwaldstraße 112, 63743 Aschaffenburg**

Kalibrierungen in den Bereichen:

Dimensionelle Messgrößen

Länge

- **Ebenheit** *)
- **Geradheit** *)

Winkel

- **Winkelnormale**

*) auch als Vor-Ort-Kalibrierung

verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15021-01-00

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit ¹⁾	Bemerkungen
Länge Ebenheit Horizontale Ebenheits- verkörperungen	bis 30 µm	bis 10 m Kantenlänge QSH, Kap. 5.4.1.1: 2019-05	$1 \mu\text{m} + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot l$	l = Kantenlänge der Ebenheitsverkörperung z.B. Prüfplatten nach DIN 876:1984
Geradheit Horizontale Geradheits- verkörperungen	bis 30 µm		$1 \mu\text{m} + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Winkel 90° -Winkel Rechtwinkligkeits- normale mit ebenen Flächen	bis 30 µm	bis 500 mm Kantenlänge QSH, Kap. 5.4.1.2:2019-05	2,1 µm	
		bis 1000 mm Kantenlänge QSH, Kap. 5.4.1.2:2019-05	2,4 µm	

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit ¹⁾	Bemerkungen
Länge Ebenheit Horizontale Ebenheits- verkörperungen	bis 30 µm	bis 10 m Kantenlänge QSH, Kap. 5.4.1.1:2019-05	$1 \mu\text{m} + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot l$	l = Kantenlänge der Ebenheitsverkörperung z.B. Prüfplatten nach DIN 876:1984
Geradheit Horizontale Geradheits- verkörperungen	bis 30 µm		$1 \mu\text{m} + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot l$	

verwendete Abkürzungen:

CMC	Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten)
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
QSH	Kalibrierverfahren der Oelze Präzisions-Meßzeugfabrik GmbH

¹⁾ In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor $k = 2$. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.